

Unión Particular para la Clasificación Internacional de Patentes (Unión de la CIP) Comité de Expertos

**Quincuagésima cuarta sesión
Ginebra, 22 y 23 de febrero de 2023**

INFORME

aprobado por el Comité de Expertos

INTRODUCCIÓN

1. El Comité de Expertos de la Unión de la CIP (en adelante, Comité) celebró su quincuagésima cuarta sesión en Ginebra, en formato híbrido, los días 22 y 23 de febrero de 2023. Estuvieron representados en la sesión los siguientes miembros del Comité: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Japón, Kirguistán, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania (37). También estuvieron representados Singapur, la Organización Eurasiática de Patentes (EAPO), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (ELSA International). La lista de participantes figura en el anexo I del presente informe.

2. Inauguró la sesión el Sr. Ken-Ichiro Natsume, subdirector general de la OMPI, quien dio la bienvenida a los participantes.

MESA

3. El Comité eligió por unanimidad al Sr. Anders Bruun (Suecia) como presidente y a la Sra. Magalie Mathon (Francia) y al Sr. Christopher Kim (Estados Unidos de América) como vicepresidentes.
4. La Sra. XU Ning (OMPI) desempeñó la función de secretaria de la sesión.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

5. El Comité aprobó por unanimidad el orden del día revisado, que figura en el anexo II del presente informe.
6. Tal como lo decidieron los órganos rectores de la OMPI en su décima serie de reuniones, celebrada del 24 de septiembre al 2 de octubre de 1979 (documento AB/X/32, párrafos 51 y 52), el informe de la presente sesión refleja únicamente las conclusiones del Comité (decisiones, recomendaciones, opiniones, etc.) y no refleja, en particular, las declaraciones hechas por cada participante, excepto en los casos en que se haya formulado o repetido una reserva en relación con alguna conclusión específica del Comité una vez alcanzada esa conclusión.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EXPERTOS

7. Los debates se basaron en una propuesta de la Oficina Internacional, que figura en el anexo 3 del expediente de proyecto [CE 549](#), relativa a las modificaciones del Reglamento del Comité.
8. El Comité observó que el artículo 9.2) del Reglamento General de la OMPI ha sido modificado desplazando el mandato de los miembros de la Mesa del comienzo de la sesión, inmediatamente después de su elección, a la última reunión de la sesión, durante la cual son elegidos. No obstante, a partir de la experiencia adquirida con el ciclo electoral de los miembros de la Mesa del Comité de Expertos de la CIP, sus subcomités y grupos de trabajo, se propuso mantener la práctica actual para los órganos relacionados con la CIP, es decir, que el mandato de los miembros de la Mesa comience inmediatamente después de su elección.
9. El Comité observó además que las modificaciones propuestas al artículo 7.1) a 3) se refieren a una mayor clarificación del ciclo electoral de los miembros de la Mesa. Además, también se propusieron algunas modificaciones al Reglamento con el fin de armonizar la terminología con el Reglamento General de la OMPI, que no alteran la esencia de las reglas.
10. El Comité aprobó el Reglamento modificado propuesto en el anexo 3 del expediente de proyecto [CE 549](#), como figura en los anexos 3 y 4 del expediente de proyecto [CE 000](#).
11. El Comité decidió además ordenar que los cambios entren en vigor inmediatamente a partir de la próxima reunión de la sesión.

INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROGRAMA DE REVISIÓN DE LA CIP

12. El Comité tomó nota de un informe de situación que figura en el anexo 20 del expediente de proyecto [CE 462](#), elaborado por la Oficina Internacional, relativo a las actividades del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP (Grupo de Trabajo), en particular, sobre el programa de revisión de la CIP.
13. El Comité observó que el número de proyectos de revisión por año se mantuvo en el mismo nivel de los últimos años. El Comité también tomó nota de que el informe de situación incluye el número de proyectos relativos a las nuevas tecnologías emergentes.

14. El Comité también observó que el número total de nuevas entradas por tipo de proyecto era mayor en los proyectos C que en los proyectos F, mientras que la mayor parte de las nuevas entradas en proyectos C que entraron en vigor en la CIP 2023.01 procedían de la clase H10, de nueva creación, que contiene el primer lote aprobado de proyectos promovidos a la CIP por el Grupo de Expertos en Tecnología de Semiconductores (EGST).

15. Además de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral, otras oficinas como las del Brasil, el Canadá, Alemania y el Reino Unido presentaron peticiones de revisión en el marco de la hoja de ruta actualizada para la revisión de la CIP (hoja de ruta). El número y la situación de todos los proyectos que se llevan a cabo en el marco de la hoja de ruta se incluyeron en el informe de situación. El elevado número de proyectos de mantenimiento corresponde a los de supresión de las referencias no limitativas del esquema.

16. El Comité expresó su gran satisfacción y reconocimiento por la labor realizada por el Grupo de Trabajo, en particular por la mayor eficiencia a la hora de determinar la reducción del periodo medio de las fases de la CIP, es decir, desde la presentación de la petición de revisión de la CIP hasta la finalización del esquema, tanto en inglés como en francés.

17. El Comité subrayó además que la calidad es tan importante como la cantidad en lo que respecta a la eficiencia de la revisión de la CIP. Se invitó al Grupo de Trabajo a tener en cuenta por igual ambos aspectos en el futuro proceso de revisión. El Comité invitó a más oficinas a participar activamente en la revisión en el marco de la hoja de ruta, teniendo en cuenta que cuanto más participación haya en la revisión, más cuestiones se plantearán y, por tanto, mejor calidad se conseguirá.

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS PROGRAMAS DE REVISIÓN DE LA CPC Y EL FI

18. La OEP hizo una presentación conjunta, en nombre de los Estados Unidos de América, sobre los últimos cambios de la CPC; el Japón presentó un informe sobre los avances y actualizaciones del FI/F-Term.

19. El Comité señaló que, a 1 de enero de 2023, casi 68,7 millones de documentos de patentes estaban clasificados en la CPC, incluidos 1,5 millones de documentos NPL. En lo que respecta a la revisión, se subrayó que, para las revisiones importantes, por ejemplo en el ámbito de las nuevas tecnologías emergentes, el esquema revisado debería aplicarse a su debido tiempo a la CIP antes de integrarlo la CPC. Además, se informó al Comité sobre la plena determinación de la OEP y la USPTO de integrar a tiempo la nueva versión de la CIP en la CPC, por ejemplo, el 1 de enero, fecha de la publicación oficial de la CIP. El Comité expresó su gratitud a la OEP y a la USPTO por su implicación en este sentido.

20. Se informó al Comité de la disponibilidad de una plataforma de intercambio de información denominada "portal de clasificación externa" que permitirá, por ejemplo, armonizar la CPC y la CIP de manera más sistemática; y muy pronto la plataforma incluirá un categorizador de textos de la CPC para ayudar a los clasificadores en la práctica de la clasificación de la CPC.

21. El Comité recordó y tomó nota de la reforma de la revisión del FI, es decir, a partir de 2023, cada revisión del FI se ajustará a la revisión de la CIP, o sea, la nueva revisión del FI entrará en vigor en enero al mismo tiempo que la publicación de la nueva versión de la CIP. El Comité también observó que la armonización del FI con la última versión de la CIP alcanzó el 99,80% en abril de 2022, y el Comité expresó su gratitud al Japón por el esfuerzo realizado para mejorar la armonización entre el FI y la última CIP.

22. Además, se informó al Comité sobre la disponibilidad de un "inventario de tecnologías de transformación verde (GXTI)", publicado por el Japón, que permite buscar documentos de

patente en las áreas relacionadas con las tecnologías de transformación verde utilizando la CIP.

23. El Comité reconfirmó el entendimiento compartido de que la coherencia entre la CIP y otras clasificaciones es importante y que debe continuar el esfuerzo para mejorar y mantener esa coherencia, en particular en el ámbito de las nuevas tecnologías emergentes.

INFORME DEL GRUPO DE ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍAS DE SEMICONDUCTORES (EGST)

24. El Comité tomó nota de un informe de situación realizado por la OEP, la oficina principal del EGST.

25. Se informó al Comité de que el primer lote de proyectos procedentes del EGST, que contiene tres nuevas subclases bajo la nueva clase H10, es decir, H10B, H10K y H10N, ha sido aprobado y ha entrado en vigor en la CIP 2023.01. Además, la nueva clase y sus subclases también se han puesto a disposición en la CPC y el FI.

26. El Comité también tomó nota de que el segundo lote de tres proyectos C, a saber, [C 514](#), [C 515](#) y [C 516](#), se puso en marcha en octubre de 2022 en el foro electrónico de la CIP, con vistas a la CIP 2024.01. Existen otras dos subclases en trámite como candidatas a proyectos C del tercer lote antes de finales de 2023.

27. El Comité expresó su profundo y sincero agradecimiento a todos los miembros del EGST y, en particular, a la OEP, oficina principal del EGST, por los considerables resultados obtenidos hasta la fecha.

28. El Comité decidió aprobar la última hoja de ruta del EGST que figura en el anexo 382 del proyecto [CE 481](#) y la continuación del proyecto, así como las actividades del EGST.

29. El Comité también alentó la participación en persona en las futuras reuniones del EGST habida cuenta de la complejidad del tema y de los profundos debates técnicos previstos.

ENMIENDAS A LA GUÍA DE LA CIP Y OTROS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA CIP

30. El debate se centró en el expediente de proyecto [CE 531](#), relativo a la adición de un nuevo párrafo para el esquema secundario en la *Guía de la CIP* (en lo sucesivo, *Guía*), y en particular en una propuesta de relator presentada por la OEP en el anexo 2, y en las observaciones de los anexos 3 a 6, presentadas respectivamente por la Federación de Rusia, la República de Corea, Suecia y China. El Comité aprobó, con algunas modificaciones, las enmiendas del anexo 2 del expediente de proyecto, que también se recopilan en el anexo 75 del expediente de proyecto [CE 454](#), junto con otras enmiendas (párrafos 31 y 32).

31. El Comité invitó al Grupo de Trabajo a revisar y armonizar las notas de los lugares de clasificación secundarios en toda la CIP y decidió crear el proyecto [M 831](#) con la OEP como relatora.

32. El debate también se basó en el anexo 75 del expediente de proyecto [CE 454](#), que contiene una recopilación de propuestas de modificación de la Guía con observaciones, en particular en los anexos 69 a 74, 76 y 77 del expediente de proyecto, presentadas respectivamente por la Federación de Rusia, la Oficina Internacional, Irlanda, la OEP, el Reino Unido y la República de Corea.

33. El Comité aprobó, con algunas modificaciones, las enmiendas al encabezamiento de la primera página, los párrafos 19, 20, 21, 22, 28, 42, 72, *74bis*, *92bis*, el encabezamiento del capítulo IX, *107bis* (nuevo), 156, *182bis* (nuevo), 183 y 187 de la Guía, que figuran en los

anexos 78 y 79 del expediente del proyecto. Esas modificaciones se incluirían en la versión de 2023 de la Guía.

34. El debate también se basó en el anexo 90 del expediente de proyecto [CE 455](#), que contiene una recopilación de propuestas de modificación de las Directrices para la revisión de la CIP (en lo sucesivo, Directrices) con observaciones, presentadas respectivamente por la OEP, la Oficina Internacional, Suecia, el Brasil y China en los anexos 85 a 89 del expediente de proyecto.

35. El Comité aprobó, con algunas modificaciones, las enmiendas al encabezamiento de la primera página, los párrafos 23, 38*bis* (nuevo), 61, 67, 70, 86*bis*, 122, 123, 126, 126*bis* de las Directrices, las enmiendas al párrafo 1 del apéndice I, al párrafo 2 del apéndice II, a los párrafos 8 y 8*bis* del apéndice IV y a las Directrices para la redacción de las definiciones de clasificación que figuran en el apéndice VI, que aparecen en los anexos 91 y 92 del expediente del proyecto.

NECESIDAD DE UN NUEVO TIPO DE SISTEMA UNIVERSAL DE INDEXACIÓN/ETIQUETADO QUE ABARQUE LAS TECNOLOGÍAS TRANSVERSALES.

36. El Comité tomó nota de una exposición oral realizada por la OEP en calidad de correlatora del proyecto [CE 502](#). Se informó de que no sería factible desarrollar un nuevo tipo de sistema de indexación o etiquetado universal que abarque las tecnologías transversales, a partir de su experiencia con la sección Y de la CPC.

37. El Comité también tomó nota de una declaración oral formulada por China, correlatora del proyecto, en la que se propone un nuevo tipo de "sistema de indexación múltiple" aplicable a las tecnologías transversales, junto con el enfoque propuesto para el proyecto y la hoja de ruta para su revisión. Se invitó a China a publicar la propuesta escrita del proyecto en el foro electrónico a fin de examinarla y estudiarla.

38. El Comité invitó a los miembros del Grupo de Expertos de este proyecto a participar activamente en el debate.

ENCUESTA SOBRE EL USO DE LA CIP EN TÉRMINOS DE NIVELES DE CLASIFICACIÓN Y OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE LISTAS DE TRABAJO DE LA CIP (IPCWLMS)

39. El debate se basó en un resumen de los resultados de una encuesta sobre el uso de la CIP en cuanto a los niveles de clasificación elaborada por la Oficina Internacional (anexo 27 del expediente de proyecto [CE 492](#)).

40. En total, se recibieron 24 respuestas de los Estados miembros de la Unión de la CIP y de la OEP.

41. En resumen, 23 oficinas que utilizan la CIP para clasificar las publicaciones de patentes nacionales utilizan el nivel completo de la CIP, y 13 de 24 oficinas reclasifican las publicaciones de patentes nacionales tras la revisión de la CIP. En nueve oficinas, la reclasificación se lleva a cabo de forma intelectual; cuatro oficinas realizan una combinación de la reclasificación intelectual y automatizada en función de los campos técnicos.

42. Se informó de que los resultados de la encuesta se utilizarán para actualizar la información del algoritmo de distribución.

43. El Comité invitó a la Oficina Internacional a seguir recopilando respuestas de forma adecuada con el fin de lograr una mayor contribución de las oficinas.

RECLASIFICACIÓN DE LA CIP BASADA EN LA IA: POSIBLE SUSTITUCIÓN DE LA “TRANSFERENCIA POR DEFECTO”

44. El Comité tomó nota de un breve documento informativo sobre el servicio de reclasificación por IA en la IPCWLMS iniciado por la Oficina Internacional, que tiene por objeto las familias de patentes que quedan por reclasificar en la fase 3 de la IPCWLMS, como alternativa a la actual transferencia por defecto (proyecto [CE 532](#)).

45. El estudio inicial se centró en presentar un sistema de producción para reclasificar documentos de patente de las versiones de 2009 a 2016, que incluyen casi dos millones de familias y unos cuatro millones de símbolos. La capacidad final del sistema permitiría procesar las versiones de 2009 a 2016, que incluyen 100 proyectos, a un ritmo de dos proyectos por semana, en menos de un año.

46. Se invitó a la Oficina Internacional a seguir recopilando los resultados de las pruebas y a poner a disposición de las oficinas la documentación pertinente para que formulen sus observaciones. Se invitó a las oficinas a considerar su participación activa en las pruebas, lo que contribuirá a la evaluación final y a la validación del servicio de reclasificación por IA para que el Comité lo estudie y adopte una decisión al respecto en una fase posterior.

OTRAS CUESTIONES

47. El Comité acordó suspender el proyecto [CE 523](#) relativo al "marco de competencias técnicas para la clasificación de patentes", en vista de la falta de actividad.

INFORME SOBRE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS RELACIONADOS CON LA CIP

48. La Oficina Internacional presentó un resumen de los avances en los sistemas informáticos relacionados con la CIP y, en particular, sobre los cambios técnicos en relación con IPCPUB/IPCCAT, IPCRMS, IPCWLMS y el aspecto común de la OMPI.

49. El Comité tomó nota de la situación del actual conjunto de datos CIP/CPC/FI publicado en IPCPUB. También se informó al Comité sobre la publicación de la CIP 2009.01 a 2016.01 en modo activo, lo que permite tanto la búsqueda ampliada en IPCPUB como la selección de símbolos en IPCWLMS.

50. El Comité también tomó nota de que la antigua herramienta de preparación de PDF se ha dejado de utilizar en favor de una nueva función de IPCPUB V.9, que permite obtener una mejor representación en PDF del esquema de la CIP.

51. Además, se informó de que IPCCAT e IPCWLMS se actualizarán con documentos de patente reclasificados en la CIP 2023.01.

52. El Comité tomó nota de que las lenguas polaca, portuguesa, serbia, eslovaca y española se añadirán al sistema de traducción de IPCRMS.

53. El Comité acordó suspender el proyecto [CE 522](#) relativo a la "divergencia en las asignaciones de la CIP".

54. El debate se basó en el anexo 8 del expediente de proyecto [CE 501](#), relativo a los ficheros maestros de definiciones y al calendario de publicación de las definiciones en la CIP.

55. El Comité tomó nota de un problema con las ilustraciones independientes del idioma para las definiciones en los ficheros maestros de la CIP, comunicado por la Oficina Internacional, y aprobó un cambio que permitirá utilizar ilustraciones dependientes del idioma en los ficheros maestros.

56. Se invitó a la Oficina Internacional a preparar una propuesta de nuevos ficheros maestros que el Comité deberá aprobar por vía electrónica antes de la publicación anticipada de la próxima versión de la CIP.

57. El Comité confirmó las dos fechas oficiales de publicación de las definiciones de la CIP, es decir, el 1 de julio y el 1 de enero, lo que permitirá que las definiciones aprobadas en la reunión de otoño del Grupo de Trabajo se integren en la publicación oficial de la CIP el 1 de enero del año siguiente.

EXPERIENCIA DE LAS OFICINAS EN LA CLASIFICACIÓN AUTOMATIZADA (POR EJEMPLO, BASADA EN LA IA)

58. El Comité tomó nota de las presentaciones sobre la experiencia con la clasificación automatizada (por ejemplo, basada en la IA) realizada por las siguientes oficinas: la OEP, Francia, el Japón y el Reino Unido.

59. El Comité observó que, además del uso de las herramientas para la clasificación de patentes y la gestión de los exámenes, por ejemplo, el envío de las solicitudes de patente a las divisiones de examen pertinentes, la mayoría de las oficinas han impulsado el desarrollo de sus herramientas en lo que respecta a la búsqueda del estado de la técnica, la asistencia a los clasificadores y examinadores de patentes en su trabajo diario y el apoyo a la reclasificación.

60. Tras dar las gracias a las cuatro oficinas mencionadas por exponer su experiencia en el desarrollo de herramientas de clasificación automatizada, el Comité reconoció la importancia del intercambio de información en este campo e invitó a más oficinas a exponer en la próxima sesión su experiencia en el desarrollo interno de herramientas de clasificación automatizada. Se informó de que todos los materiales de presentación, incluidos los antiguos, están disponibles en el foro electrónico de la CIP bajo el proyecto [CE 524](#).

CLAUSURA DE LA SESIÓN

61. El presidente clausuró la sesión.

62. El Comité de Expertos aprobó por unanimidad el presente informe por vía electrónica el 20 de marzo de 2023.

[Siguen los anexos]

LISTE DES PARTICIPANTS/
LIST OF PARTICIPANTS

I. ÉTATS/STATES

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French)

ALLEMAGNE/GERMANY

Stefanie GABRIEL (Ms.), Senior Adviser, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Oliver STEINKELLNER (Mr.), Head, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Abdullah ALGHAMDI (Mr.), Patent Expert, Patents Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Rawabi ALMUHIMED (Ms.), Patents Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Fahad ALNAFJAN (Mr.), Patent Expert, Patents Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Abdulhakim ALSAEED (Mr.), Patent Examination Specialist, IP Operations Patents/Mechanical Engineering Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Faisal ALOTAIBI (Mr.), Senior IP Information Analyst, IP Information Center, Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA

Silvia CAMPILLAY (Ms.), Jefe de División, Área de Procesos Industriales - Polímeros, Alimentos y Textiles, Administración Nacional de Patentes (ANP) - Departamento de Examen Sustantivo, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Buenos Aires

Eduardo SANCHIRICO (Sr.), Jefe de Departamento, Estudio de Fondo Técnico Químico, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Buenos Aires

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Markus KLAIBER (Mr.), Examiner and Classification Coordinator, IP Australia, Canberra

Mu-En TIEN (Mr.), Patent Examiner, IP Australia, Melbourne

Kevin CAI (Mr.), Delivery Manager, IP Australia, Canberra

Zohair HUSSAIN (Mr.), Assistant Director, International ICT Cooperation, IP Australia, Canberra

Dat HUYNH (Mr.), IP Australia, Garran

AUTRICHE/AUSTRIA

Akos BAZSO (Mr.), Examiner, Austrian Patent Office, Vienna

BRÉSIL/BRAZIL

Catia VALDMAN (Ms.) Head of the Electronics and Computer Division, Head of the Classification Group, Secretariat for Competitiveness and Regulation, Ministry of Development, Industry, Trade and Services, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Rodrigo FERRARO (Mr.), Patent Examiner, Secretariat for Competitiveness and Regulation, Ministry of Development, Industry, Trade and Services, National Institute of Industrial Property (INPI), Belo Horizonte

Darcio GOMES PEREIRA (Mr.), Patent Examiner, Pharmacy, Secretariat of Economic and Development and Tourism, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

Tatielli BARBOSA (Ms.), Patent Examiner, Inorganic Chemistry Division and Classification Group, Special Secretariat for Productivity, Employment and Competitiveness, Ministry of Economy, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro

BULGARIE/BULGARIA

Radoslava MLADENOVA (Ms.), Patent Examiner, Directorate “Examination and Protection of Inventions, Utility Models and Industrial Designs”, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

Aneta KOLEVA (Ms.), Patent Examiner, Directorate “Examination and Protection of Inventions, Utility Models and Industrial Designs”, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

CANADA

Nancy BEAUCHEMIN (Mme), Gestionnaire de programme - International, Direction des brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), Innovation, Sciences et Développement Économique Canada ISDE, Gatineau

CHINE/CHINA

DONG Yan (Ms.), Level II Principal Staff Member, Patent Documentation Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

HU An (Ms.), Director, Patent Cooperation Division, Patent Documentation Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

XU Lina (Ms.), Research Expert, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

ZHANG Chan (Ms.), Divisional Quality Control Manager, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

CROATIE/CROATIA

Gordana RICIJAŠ (Ms.), Head of Patent Examiners, Patent Department, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb

Marija JAZVIĆ MIOKOVIĆ (Ms.), Senior Administrative Advisor in the Field of Mechanics and Related Fields, Patents Department, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb

DANEMARK/DENMARK

Sven NYTOFT RASMUSSEN (Mr.), Senior Examiner, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT

Heba ABDELREHIM (Ms.), Pharmaceutical Patent Examiner, Patent Technical Examination, Higher Education and Scientific Research, Egyptian Patent Office, Cairo

Marwa HOSNY (Ms.), Pharmaceutical Patent Examiner, Patent Technical Examination, Higher Education and Scientific Research, Egyptian Patent Office, Cairo

Nourhan RYHAN (Ms.), Patent Examiner, Patent Technical Examination, Higher Education and Scientific Research, Egyptian Patent Office, Cairo

ESPAGNE/SPAIN

Mario CAÑADAS (Sr.), Jefe del Servicio de Documentación, Departamento de Patentes y Tecnologías de la Información, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid

Elena PINA (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, División de física y de patentes eléctricas, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Tiina LILLEPOOL (Ms.), Principal Examiner, Patent Department, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Christopher KIM (Mr.), Director, Classification Quality and International Coordination, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Richard LEE (Mr.), International Patent Classifier, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

David D. LE (Mr.), International Patent Classifier, Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Washington DC

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Zoya VOYTSEKHOVSKAYA (Ms.), IPC Section, Federal Institute of Industrial Property (FIPS)
ROSPATENT, Moscow

Lada TSIKUNOVA (Ms.), IPC Section, Federal Institute of Industrial Property (FIPS)
ROSPATENT, Moscow

Tatiana KOLOTILINSKAYA (Ms.), Chief Specialist, International Cooperation Department,
Federal Institute of Industrial Property (FIPS), ROSPATENT, Moscow

Vladislav MAMONTOV (Mr.), Head, Multilateral Cooperation Division, International Cooperation
Department, Federal Service for Intellectual Property (FIPS), ROSPATENT, Moscow

Ekaterina PAVLOVA (Ms.), Leading Specialist, Multilateral Cooperation Division, International
Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property (FIPS), ROSPATENT,
Moscow

FINLANDE/FINLAND

Antti HOIKKALA (Mr.), Senior Patent Examiner, Patents and Trademarks, Finnish Patent Office
(PRH), Helsinki

FRANCE

Magalie MATHON (Mme), chargée de mission CIB, Département des Brevets, Institut national
de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

IRLANDE/IRELAND

Fergal BRADY (Mr.), Examiner of Patents, Patent Examination, Intellectual Property Office of
Ireland, Kilkenny

ISRAËL/ISRAEL

Yoav SIN MALIA (Mr.), Head, Information Systems, Patents, Israel Patent Office, Ministry of
Justice, Jerusalem

Orit REGEV (Ms.), Deputy Superintendent of Examiners, Israel Patent Office, Ministry of
Justice, Jerusalem

JAPON/JAPAN

Kenichi HASEHIRA (Mr.), Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office
(JPO), Tokyo

Taiki OKI (Mr.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office
(JPO), Tokyo

Masaya OTE (Mr.), Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office
(JPO), Tokyo

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN

Ainura ABYKANOVA (Mr.), Industrial Property Expertise Department, State Agency of Intellectual Property and Innovation under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek

MEXIQUE/MEXICO

Kevin URIEL ALENCASTER VILLA (Sr.), Experto en Propiedad Intelectual, Dirección Divisional de Asuntos Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

Pablo ZENTENO MARQUEZ (Sr.), Experto en Propiedad Intelectual, Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México

NORVÈGE/NORWAY

Bjørn TISTHAMMER (Mr.), Head of Section, Patent Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Frogner

Bente AARUM-ULVÅS (Ms.), Chief Examiner, Patent Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Robert SCHOUWENAARS (Mr.), Technical Advisor, Netherlands Patent Office, Ministry of Economic Affairs, The Hague

POLOGNE/POLAND

Małgorzata KOZŁOWSKA (Ms.), Patent Examiner, Biotechnology and Chemistry Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

Piotr CZAPLICKI (Mr.), Director, Biotechnology and Chemistry Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

PORTUGAL

Fedra OLIVEIRA (Ms.), Patent Examiner, Patents and Utility Models Department, Portuguese Institute of Industrial Property, Ministry of Justice, Lisbon

Roxana ONOFREI (Ms.), Patent Examiner, Patents and Utility Models Department, Portuguese Institute of Industrial Property, Ministry of Justice, Lisbon

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

HAN Donghee (Mr.), Head of Data Science Group, IP Classification Strategy TF Team, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

JEONG Jieun (Ms.), Classification Group, IP Classification General Team, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

JUNG Byungte (Mr.), Head of IP Classification General Team, IP Classification Center, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon
LEE Wangseok (Mr.), Head of Int. Classification Group, IP Classification General Team, Korea Institute of Intellectual Property Promotion (KIPRO), Daejeon

PARK Sungchul (Mr.), deputy director, Patent Legal Administration Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

SHIN Jieun (Ms.), Assistant Deputy Director, Patent Examination Policy Coordination Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

LEE Jinyong (Mr.), IP Attaché, Economy, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Natalia CAISIM (Ms.), Head of Examination Division, Patents, State Agency on Intellectual Property, Chisinau

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA

JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information, Industrial Property Office of the Czech Republic, Prague

Petr FIALA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ROUMANIE/ROMANIA

Adrian NEGOITA (Mr.), Head of Mechanics, Patent Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Anca Simona IONESCU (Ms.), Patent Examiner, Patent Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeremy COWEN (Mr.), Senior Patent Examiner - Classification, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UKIPO), Newport

Howard CHEN (Mr.), Data Scientist, Transformation - Secure IP, UK Intellectual Property Office, (UKIPO), Newport

Colm MCKENNA (Mr.), Data Scientist, Transformation - Secure IP, UK Intellectual Property Office, (UKIPO), Newport

SERBIE/SERBIA

Milan MILJEVIĆ (Mr.), Senior Examiner, Department for Mechanical and Electrical Engineering, Belgrade

SUÈDE/SWEDEN

Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Patent Division, Swedish Patent and Registration Office (PRV), Stockholm

Tomas LUND (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Division, Swedish Patent and Registration Office (PRV), Stockholm

Moa EMLING (Ms.), Senior Patent Examiner, Chemistry - Patent Department, Swedish Patent and Registration Office (PRV), Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Pascal WEIBEL (M.), chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne

UKRAINE

Halyna DOBRYNINA (Ms.), Leading Intellectual Property Professional, Unit of Patent Information and Documentation, Ministry of Economy of Ukraine, State Organization “Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations” (UANIPPIO), Kyiv

Dmytro PROKOPENKO (Mr.), Intellectual Property Professional, Unit of Work with International Classifications and Standards, Ministry of Economy of Ukraine, State Organization “Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations” (UANIPPIO), Kyiv

II. ÉTAT OBSERVATEUR/OBSERVER STATE

SINGAPOUR/SINGAPORE

Ning DU (Ms.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Lei HONG (Mr.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Cheow Hin SIM (Ms.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analysis, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO)

Valery MALAY (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering Division, Examination Department, Moscow

Saparbay EMINOV (Mr.), Counselor, Legal and Management Department, Moscow

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)

Jose ALCONCHEL UNGRIA (Mr.), Director, Classification and File Management, Rijswijk

Pierre HELD (Mr.), Project Manager, CPC Co-operation, Directorate Classification and File Management, Rijswijk

Roberto IASEVOLI (Mr.), Head Classification Board, Directorate Classification and File Management, Rijswijk

Alexander KLENNER-BAJAJA (Mr.), Head of Data Science, Data Science, Rijswijk

Agnès MERLE GAMEZ (Ms.), Classification Board Member Section Chemistry, Directorate Classification and File Management, Rijswijk

**IV. ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE/NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATION**

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students'
Association (ELSA International)

Tsz Ching LAI (Ms.), Head of Delegation, Brussels

Leyli AHMADOVA (Ms.), Delegate, Brussels

Paula BAČIĆ (Ms.), Delegate, Brussels

Hager KHALIL (Ms.), Delegate, Brussels

V. BUREAU/OFFICERS

président/Chair: Anders BRUUN (M./Mr.) (Suède/Sweden)

vice-présidents/: Christopher KIM (M./Mr.) (États-Unis d'Amérique/
Vice-Chairs United States of America)
Magalie MATHON (Mme/Ms.) (France)

secrétaire/
Secretary: XU Ning (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

**VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)**

Ken-Ichiro NATSUME (M./Mr.), sous-directeur général du Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Assistant Director General, Infrastructure and Platforms Sector

Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Director, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

XU Ning (Mme/Ms.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Head, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Rastislav MARČOK (M./Mr.), administrateur principal de la classification des brevets de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Senior Patent Classification Officer, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Olivier COLLIOUD (M./Mr.), administrateur de projets de la Section des systèmes informatiques, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Project Officer, IT Systems Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Isabelle MALANGA SALAZAR (Mme/Ms.), assistante à l'information de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Information Assistant, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

[L'annexe II suit/
Annex II follows]

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión
2. Elección de la presidencia y de dos vicepresidencias
3. Aprobación del orden del día
4. Modificación del Reglamento del Comité de Expertos
Véase el proyecto [CE 549](#).
5. Informe sobre la marcha del programa de revisión de la CIP
Véase el proyecto [CE 462](#).
6. Informe sobre la marcha de los programas de revisión de la CPC y el FI
Informes de la OEP y la USPTO sobre la CPC, y de la JPO sobre el FI.
7. Informe del Grupo de Especialistas en Tecnologías de Semiconductores (EGST)
Véase el proyecto [CE 481](#).
8. Enmiendas a la *Guía de la CIP* y otros documentos básicos de la CIP
Véanse los proyectos [CE 454](#), [CE 455](#) y [CE 531](#).
9. Necesidad de un nuevo tipo de sistema universal de indexación/etiquetado que abarque las tecnologías transversales
Véase el proyecto [CE 502](#).
10. Encuesta sobre el uso de la CIP en términos de niveles de clasificación y otras cuestiones relacionadas con la solución de gestión de listas de trabajo de la CIP (IPCWLMS)
Véanse los proyectos [CE 492](#) y [CE 549](#).
11. Reclassificación de la CIP mediante IA: posible sustitución de la “transferencia por defecto”
Véase el proyecto [CE 532](#).
12. Otras cuestiones
Véase el proyecto [CE 549](#).
13. Informe sobre los sistemas informáticos relacionados con la CIP
Presentación de la Oficina Internacional. Véase el proyecto [CE 501](#).
14. Experiencia de las oficinas en la clasificación automatizada (por ejemplo, mediante IA)
Presentaciones de las oficinas. Véase el proyecto [CE 524](#).
15. Aprobación del informe
16. Clausura de la sesión

[Fin del anexo II y del documento]